

The tables below list Relative Sensitivity Factors (RSFs) based on data from R.G. Wilson (Int. J. Mass Spectrometry and Ion Processes, 143, 43, 1995). RSFs indicate how the sensitivity of detection varies depending on the element of interest.

- Lower RSF values correspond to higher sensitivity (meaning that ions can be detected even at low concentration).
- Even modest concentrations of elements with high sensitivity can saturate electron multiplier ion detectors so these can not be measured.

O⁻ primary beam

The following RSFs have been measured for oxygen primary ion bombardment, positive secondary ions, and a silicon matrix.

RSF Ranges (atom/cc)																		He													
H																		E27													
E24																															
Li	Be																B	C	N	O	F	Ne									
E20	E22																E22	E24	E25	E25	E23	E27									
Na	Mg																Al	Si	P	S	Cl	Ar									
E20	E21																E21	E22	E24	E24	E24	E26									
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr														
E20	E21	E21	E21	E21	E21	E22	E22	E22	E22	E22	E24	E21	E23	E24	E24	E24	E25														
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe														
E20	E21	E21	E21	E22	E22		E22	E22	E23	E22	E23	E21	E22	E23	E24	E24	E25														
Cs	Ba	La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn														
E20	E21	E21	E22	E22	E23	E24	E23	E23	E24	E24	E24	E21	E22	E23																	
Fr	Ra	Ac																													
																		Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
																		E21	E21	E21		E21	E21	E21	E21	E21	E21	E21	E21	E21	E21
																		Th	Pa	U											
																		E22		E21											